

NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD

CEI
IEC
60749

Edition 2.2
2002-04

Edition 2:1996 consolidée par les amendements 1:2000 et 2:2001
Edition 2:1996 consolidated with amendments 1:2000 and 2:2001

**Dispositifs à semiconducteurs –
Essais mécaniques et climatiques**

**Semiconductor devices –
Mechanical and climatic test methods**

IEC 60749 Ed. 2.2 - Preview only Copy via ILNAS e-Shop

Without
Drawing



Numéro de référence
Reference number
CEI/IEC 60749:1996+A1:2000+A2:2001